10;11

Рентгеновский метод исследования эмиссионной поверхности взрывного катода

© М.А. Поляков, Г.Н. Фурсей, Л.А. Широчин, А.А. Контонистов

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) E-mail:Ishir@LS4126.spb.edu

Поступило в Редакцию 17 декабря 2007 г.

Представлены результаты импульсной радиографии отпечатков электронного пучка на аноде диода со взрывоэмиссионным катодом. Показано, что данная методика может дать объективную информацию о характере эмиссионного пятна на поверхности взрывного эмиттера и позволяет провести предварительные оценки возможности его использования для формирования электронных пучков в конкретной диодной конфигурации.

PACS: 52.80.-s, 52.80.Qj

Исследования распределения токов автоэлектронной и взрывной электронной эмиссий по поверхности катода всегда являлись важнейшей задачей физической электроники, так как позволяли сделать обоснованные выводы не только о механизмах процессов, но и о возможностях использования таких источников в конкретных диодных системах. При исследованиях взрывной электронной эмиссии (ВЭЭ) использовались высокоскоростные электронно-оптические преобразователи (ЭОП) и фотоэлектронные умножители (ФЭУ), контролирующие развитие свечения на катоде и во всем диодном зазоре [1]. В режиме автоэлектронной эмиссии (АЭЭ) таким классическим прибором

1



Рис. 1. Схема эксперимента: *1* — катод; *2* — облако катодной плазмы; *3* — электронный пучок; *4* — бериллиевый анод с пленкой тяжелого металла; *5* — диафрагма лохкамеры; *6* — рентгеновское излучение, прошедшее через диафрагму лохкамеры; *7* — приемник рентгеновского излучения.

является проектор Мюллера [2]. Однако использование проектора в режимах ВЭЭ, даже в наносекундном диапазоне импульсов, затруднено, так как большие значения плотностей энергии, выделяющейся на любом люминоформном слое, регистрирующем свечение пучка, приведут к его разрушению.

Для оценки возможностей использования взрывоэмиссионных катодов в наносекундных режимах длительности импульсов мы применили схему, представленную на рис. 1. Исследуемый катод 1 помещается в вакуумную трубку, на анод 4 которой, выполненный из прозрачного для рентгеновского излучения металла, с вакуумной стороны наносится слой тяжелого металла, в котором и возникает излучение. Толщина слоя выбирается исходя из параметров анодного напряжения. С внешней стороны трубки организуется лохкамера — металлический корпус, в одной из стенок которого установлена диафрагма с малым отверстием 5. Материал, толщина корпуса и диафрагмы выбираются из условия полного поглощения неиспользованного рентгеновского излучения (см., например, [3]). У противоположной стенки корпуса устанавливается приемник излучения 7, прошедшего через отверстие в диафрагме.

На рис. 2, *а* представлен рентгеновский снимок катода диаметром *D* = 0.7 mm из углеграфитового материала — полиакрилонитрильного

Письма в ЖТФ, 2008, том 34, вып. 14



Рис. 2. Радиографические изображения взрывоэмиссионных катодов.

(ПАН) углеродного волокна [4]. На диод подавались импульсы напряжением U = 40 kV, длительностью t = 70 ns, при диодном зазоре d = 2 mm. Видно, что эмиссия происходит из дискретных эмиссионных центров. Оценки, проведенные по формуле для размеров рентгеновских пятен, наблюдаемых с помощью лохкамеры [3], показывают, что размеры регистрируемых отдельных центров эмиссии составляют величину $r \sim 10 \,\mu$ m, хотя при известной величине скорости разлета катодной плазмы $v \approx 2 \cdot 10^6$ cm/s [1] она покрывает практически всю поверхность

1* Письма в ЖТФ, 2008, том 34, вып. 14

эмиттера. Очевидно, что в этих режимах величина катодного скачка потенциала в плазме ВЭЭ достаточно велика, чтобы генерируемый пучок проходил через катодную плазму практически без рассеяния, передавая информацию о размерах зоны, в которой инициируется и поддерживается эмиссионный процесс.

На рис. 2, *b* представлены снимки, полученные на композиционном углеродном материале в форме таблетки D = 0.8 сm, полученной прессованием порошка — продукта холодной деструкции графита [5]. Параметры импульсов напряжения: U = 45 kV, t = 20 ns, диодный зазор d = 1.5 mm. Видно, что эмитируют отдельные области размером $r \sim (1-1.5)$ mm.

Качественно другая картина может быть получена в том же режиме при создании на эмиттере области резкого усиления внешнего поля. В центре указанной таблетки было высверлено отверстие диаметром 2 mm, что привело к появлению на краях отверстия области усиления поля. На рис. 2, с представлен снимок, полученный для этого катода при тех же параметрах напряжения и геометрии диода, — практически однородное кольцо. Таким образом, был получен цилиндрический электронный пучок с высокой воспроизводимостью изображения от импульса к импульсу.

И наконец, приведем картину, из которой следует, что на том же катоде, варьируя диодный зазор (d = 3 cm, U = 30 kV), можно сформировать практически однородное круглое пятно в центре анода (рис. 2, d). Аналогичный результат можно получить, подбирая напряжение на диоде.

Таким образом, представленные результаты позволяют говорить об относительно простой методике предварительной проверки возможности применения различных по конфигурации и материалам взрывоэмиссионных катодов. Очевидно, что детальные измерения токов катода, в сочетании с методикой фотометрирования получаемых ренгтеновских снимков, позволят сделать обоснованные выводы о распределении инициирующих эмиссионных центров на катодах при ВЭЭ, распределении плотности тока в них, оценить возможности их использования в конкретных диодных системах для получения электронных пучков различных параметров в желаемой конфигурации.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 06-08-00339 и 07-02-00372.

Письма в ЖТФ, 2008, том 34, вып. 14

Список литературы

- [1] Месяц Г.А., Проскуровский Д.И. Импульсный электрический разряд в вакууме. Новосибирск: Наука, 1984. 256 с.
- [2] Елинсон М.И., Васильев Г.Ф. Автоэлектронная эмиссия. М.: Физматгиз, 1958. 272 с.
- [3] Иванов С.А., Щукин Г.А. Рентгеновские трубки технического назначения. Л.: Энергоатомиздат, 1989. 201 с.
- [4] Фитцер Э. Углеродные волокна и углекомпозиты. М.: Мир, 1988. 336 с.
- [5] Petrick V.I. Patent N 2128624, Russia.

Письма в ЖТФ, 2008, том 34, вып. 14